# 激光等离子体低能 X 光辐射的研究与探测

欧阳斌 余加进 陆海鹤 李 弘 毅 (中国科学院上海光机所) (美国,洛斯·阿拉莫斯国家实验室)

提要:本文讨论激光等离子体低能 X 光辐射机理及其测试问题。

#### Study of super-soft X-ray emission from laser plasma

Ouyang Bin, Yu Jiajin, Lu Haihe (Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica) P. H. Y. Lee

(Los Alamos National Lab., USA)

Abstract: The emission and detection of super-soft X-ray from laser produced plasma are discussed.

## 

高功率激光加热各种靶产生的激光等离 子体出现各种不同的辐射。这些辐射的出现 与消失正是等离子体存在的表现,而等离子 体的特性也正是从测量这些不同辐射中得知 的。X 光是最令人感兴趣的辐射之一。

### 等离子体的低能 X 光辐射

随着激光巨大脉冲能量向靶面灌输,靶 材从表面,然后逐步深入地被离化。先离化 的离子、电子又参加正在进行的激光与靶的 相互作用,继续产生等离子体。等离子体的 密度梯度温度梯度不为零,必存在碰撞扩散 等复杂的运动。在复杂的运动中,电子受到 电场磁场作用,其速度发生变化。根据经典 理论知道,它必然有一种辐射,它的辐射功率 量子力学表达式为:

$$U_{fTe} = \frac{N_e \cdot N_i n \cdot Z_e^2 6}{3\sqrt{6\pi^3} \cdot \varepsilon^3 O^3 \sqrt{m^3}} \times \frac{\bar{g}}{\sqrt{KT_e}} \exp\left[-\frac{hf}{KT_e}\right] \quad (1)$$

式中 Z 为原子序数, $\overline{g}$  为岗特因子,n 为折射 率, $\varepsilon_0$  为介电常数,m 为电子质量, $N_e$ , $N_i$  为 电子离子密度,e 为电子电荷。

式(1)给出电子运动因速度发生变化时 向空间辐射的一种电磁波的功率。这种辐射 称为轫致辐射。

另外,除上述辐射外,高密度的离子中的 正负离子相互碰撞而出现复合,伴随这过 程的辐射称为复合辐射,其辐射功率由下

收稿日期: 1985年10月18日。

治疗非常

式描述:

$$U_{nfTe} = \frac{e^{10} \cdot N_i \cdot N_e}{12 \pi \sqrt{6 \pi C^3} m^{12} \varepsilon_0^{15}} \times Z^4 \frac{\bar{g}}{n^3 \cdot \sqrt{KT^3}} \exp\left[-\frac{hf - |E_i|}{KT_e}\right]$$

这种辐射与复合能级 E<sub>i</sub> 有关。

比较式(1)、(2)可知,对于高温等离子体,如激光产生的等离子体,KT。值较大,其 辐射主要来自轫致辐射,而且在低能区里更 可观,更令人感兴趣,便于探测。

#### 低能X光的测量原理

低能 X 光的测量,用常规 X 光测量方 法是不利的,我们采用下述方法。当 X 光入 射到金属材料上时,其电子受到激发,能量大 于脱出功的电子,射入空间。能量一定的 X 光光子,打出的光电子数也是确定的。测量 光电子数,便实现了对 X 光的测量。



图1是这种测量的示意图。X 光透过 网状阳极入射到金属材料上,产生的光电子 云被强电场拉到阳极,由网状阳极收集。这 种结构是人们所熟悉的"二极管",但只适于 X 光波段。

阴极材料是镍的二极管,其对 X 光灵敏 曲线如图 2 所示。纵坐标为灵敏度(单位 pC, 横坐标为光子能量(单位 为 keV)。由 图 可 见,低能区比高能区的灵敏度高 1~2 个量 级。



### 实验与结果分析

据上述原理,我们研制了适合于几百至 一千多电子伏的 X 光测量装置,称为 Y、Q、 探测器,示于图 3。



M-磁头; P-准直管; A-阳极; C-阴极

图中磁头 M 是永磁体,场强为 500 Gs; 准直管 P 是 30 cm 的紫铜管; 滤片 F 是铝 材料制的薄膜,厚 2 $\mu$ m; 阳极 A 是透过率 很高的铜网,带有 2.5 kV 工作电压; 阴极 O是镍材料制成的锥形电信号引出极。

用这一探测装置做了多次实验,都得到 理想的结果。实验装置及探测器的相对位置 如图4所示。激光器的输出功率10°W,由 非球面透镜聚焦到靶上。与激光束成50° 角的方位上安放Y、Q、探测器,它的输出由 千兆周示波器记录。Y、Q,探测器工作电压 可以在2.5~2.7kV范围选定。 脉冲激光束入射到靶T上产生等离子 体,等离子体辐射的X光被50°方位安放

• 14 •



的探测器 D 接收,它给出 X 光脉冲信号。

图 5 给出三张实验中得 到 的 示 波 器 照 片。由 Y.Q.结构原理探头给出的信号是由 下述因素决定的低能 X 光信号:

1. 磁头和滤片把某些带电粒子去掉,防 止它们进入Y.Q.造成假信号,就是说,只有 X.光进入探测器产生信号。



图 5 典型的波形图 (上)金靶 (中)钽靶 (下)碳靶 垂直 50 V/div 垂直 50 V/div 垂直 10 V/div 水平 10 ns/div 水平 5 ns/div 水平 10 ns/div

2. 滤片是 2μm 厚的铝箔, 它的透过率 曲线如图 6 所示<sup>[11]</sup>。纵坐标为 X 光光子能 量。可见在低能区, 能量为 700 eV~1.5 keV 的 X 光光子有最大透过。

3. 综合透过率曲线与镍阴极的响应灵 敏度曲线,便可计算得到探测器的灵敏度依 赖能量的关系曲线,示于图 7。纵坐标为探





图7 探头响应灵敏度曲线

头的响应灵敏度,横坐标为 X 光光子能量。 图 5 表示不同的靶材在能量相近的激光 脉冲(双脉冲)辐照下,产生的 X 光有极大的 差异。我们用低 Z碳靶、高Z 金靶及居于其中 的钽靶,获得不同的 X 光波形。下面简单分 析说明波形幅度是 X 光产额的 直接表示。

设X 光以总能量 W 入射到 探测器上。 又设每个光子的平均能量为 E,则光子数为 N 时有关系式 W=NE。在这些能量作用 下,获得 n 个光电子,对应的电流在示波器输 入端电阻为 R=50Ω 上产生电压 V,即 V=ηneR/t

η 为光电子的收集效率, e 为电子电荷, t 为
脉冲波形宽。在选定的阴极材料情况下有:
V = ηReN Eφ/t (3)
其中 φ 为转换效率。所以波形的幅度表示
了 X 光产额,或光子数。比较图 5 波形,参
(下转第 23 页)

距屏幕为 | R | 的物点由屏幕所形成的象 斑尺寸可写为:

$$\Delta x(R) = \frac{|R|}{R_I} \max_{[x_1, x_2]} \{ \delta_x(x_{o0}, x_1) - \delta_x(x_{o0}, x_2) \}$$

我们可以按等式(2)和(3)求得列于表1 的全息屏幕在不同成象范围上的象差  $\delta_{a}$ 、 $\delta_{y}$ 值。图5为屏幕的象差曲线。

表1 全息屏幕不同成象范围上的象差值

屏幕成象范围 <i>x(y)</i> ,( <b>mm</b> )	$\delta_x(\mathrm{mm})$	$\delta_y(\text{mm})$
-150	-14.10	60.90
-100	-5.60	27.40
- 50	-1.50	8.50
0	0 wilcias	0
50	10.00	-1.90
100	-34.00	-0.30
150	-74.00	0.60

屏幕在最大成象范围 (x1=-150 mm,  $x_2 = 150 \text{ mm}$ ) 成象时的弥散斑尺寸可由(14) 式求得:

 $\Delta x(R) = \frac{|R_c|}{R_I} \max_{[x_1, x_2]} \{\delta_{x_1} - \delta_{x_2}\}$  $=\frac{1.64}{3.31}[-0.0744]$ 

-(-0.0141)] = -0.0293m 所以,若投影物镜出瞳尺寸 2ba×2by=100× 100时,由(12)式求得有效视觉区域尺寸为.

(14)

(上接第15页)

考式(1)、(2)可以推断, Y.Q.探测的 X 光是 等离子体的轫致辐射,并非复合辐射。因为 波形的幅度比远远不符合于式(2)中的Z的 四次方关系。

应该说明,示波图给出的电压变化,并不 能由上式(3)所能表示,只是为了简单分析起 见才用它。探头的时间响应函数还得另外推 算,本文从略。但X光产额依赖于原子序数 Z 的关系是选择靶材的依据, 根据这点可以



图5 全息屏幕的象差曲线

 $d_{v_{\text{MW}}} = 2b_{\alpha}(R_{I}/|R_{c}|) - \Delta x = 172 \,\mathrm{mm}$ 我们曾按测量视觉区域平面上的不变照度范 围来确定有效视觉区域的尺寸, 证明上述结 果与实验相一致。

Ż

徐昆贤; 《仪器仪表学报》, 1983, 4, No. 4, 357. [1]

[2] 徐昆贤; 《中国激光》, 1983, 10, No. 6, 362. [3] E. B. Champagne; JOSA, 1967, 57, 51.

[4] Г. Н. Буйнов и др.; Опт. и спектр., 1973, 34, No. 4, 768~774.

[5] J. L. Rayces; Optica Acta, 1964, 11, 85.

选择各种原子序数的材料,去做特殊目的的 实验。

本工作得到邓钖铭、徐至展同志的关心, 实验中得到殷光裕同志实验组的大力支持, 在此表示感谢。

Eugene P. Bertin; "Principles and Practice o [1] X-Ray Spectrometric Analysis", Second Eeition, Plenum Press New York, London, 1975.